

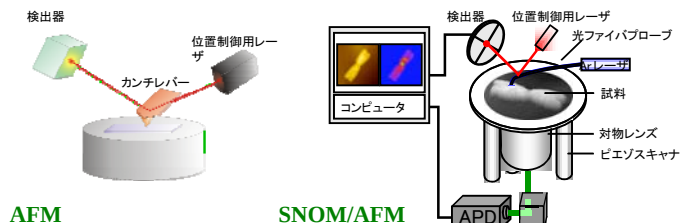
走査プローブ顕微鏡(SPM)とその特徴

AFM (原子間力顕微鏡)

シリコン製の鋭い探針で試料の表面を走査してナノレベルの分解能で形状像を得ることができる。

SNOM/AFM (走査型近接光学原子間力顕微鏡)

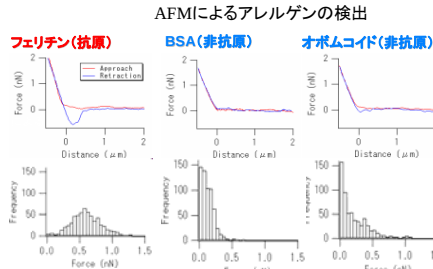
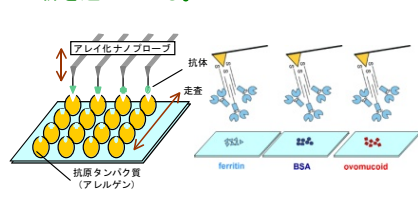
AFMの探針を光ファイバー製に変えたもので、形状像と同時に通常の光学顕微鏡を超える分解能で蛍光像を得ることができる。



研究の内容

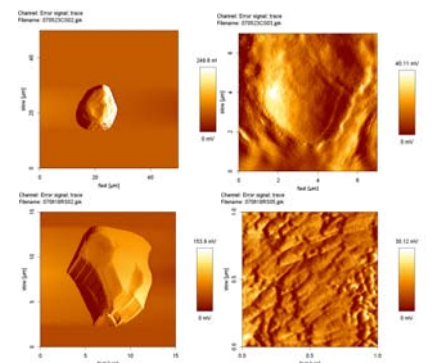
SPMによるタンパク質解析とアレルゲン検出

AFMの微弱力測定機能により、タンパク質の力学的特性やタンパク質間相互作用の解析を進めている。



SPMによるナノスケール食品素材の計測評価技術の開発

デンプン顆粒表面のAFM像 (上、トウモロコシ。下、コム)

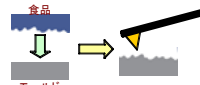


汎用的食品微細構造計測手法の開発

含水状態での食品ナノ表面構造計測技術の開発



食品ナノインプリンティング手法の開発

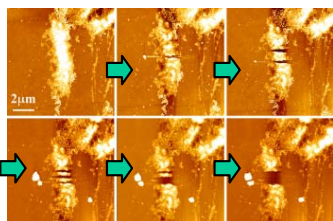


食品ナノ粒子、食品ナノ表面の汎用計測・評価技術の確立

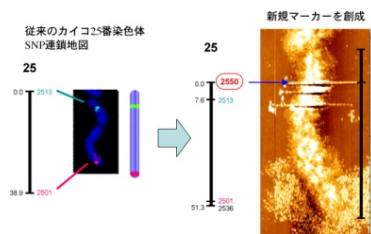
SPMのゲノム解析への適用

SNOM/AFMによる遺伝子(マーカー)位置の高分解能検出、AFMによる染色体の連続切断回収とDNA増幅に基づく、新規ゲノム解析手法の開発を推進している。

染色体断片の連続切断



新規連鎖地図マーカーの創出



DNA増幅と塩基配列解析



今後の展開

SPM技術と従来の生化学的、分子生物学的技術を融合した新規な生体試料解析法の開発を進めるとともに、対象をアレルゲンの迅速検出、ナノスケール食品の構造・物性計測等へ順次拡大していく予定。

参 考

1. Atomic Force Microscopy Investigation of Influence of Disorder Process on the Rice Starch Surface ; A. Ayoub, T. Ohtani and S. Sugiyama. Starch/Stärke, in press.
2. Dissection and High-yield Recovery of Nanometer-Scale Chromosome Fragments Using an Atomic-Force Microscope; K Tsukamoto, S Kuwazaki, K Yamamoto, T Ohtani, and S Sugiyama. Nanotechnology, 17, 1391-1396.
3. 原子間力顕微鏡 (AFM) による染色体の切断および回収: 塚本和己・桑崎誠剛・山本公子・七里元晴・吉野智之・大谷敏郎・杉山滋・表面科学 26, 404-409 (2005).